

QVI SNAP™ DM350

大范围数字式测量设备

RAM

SNAP DM350 的视场范围得到扩展，方便测量大的产品，如电路板，金属薄片面板和工艺品。

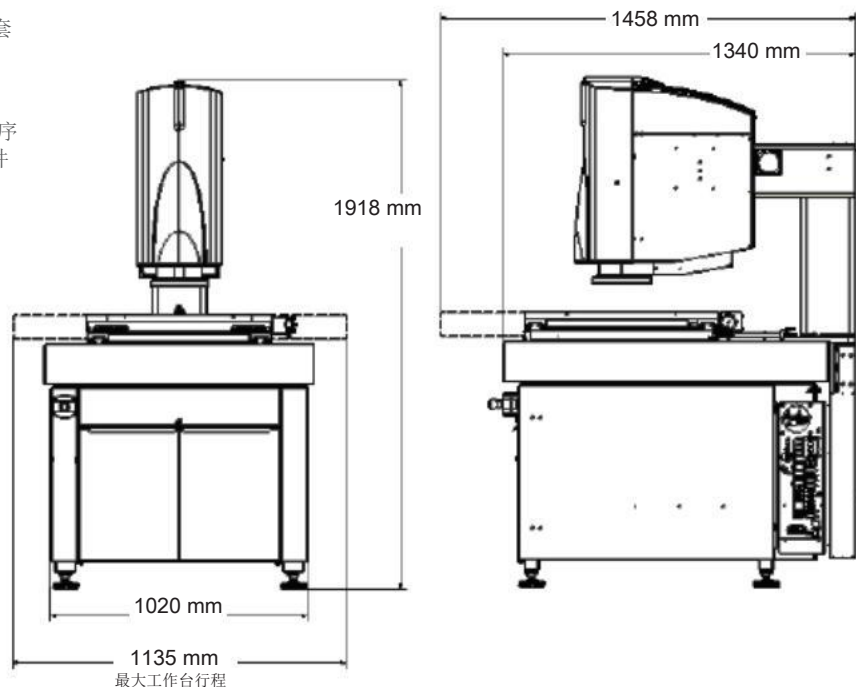
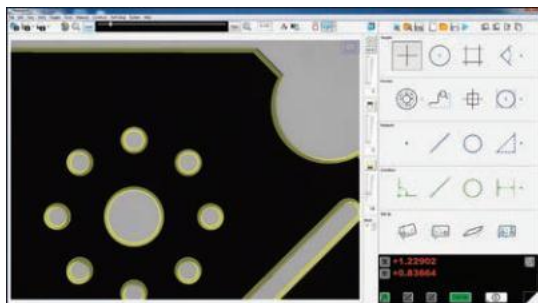
- 350 x 350 x 150 mm 工作台行程，适合大体积产品零件
- 两个光学放大倍率可以为小的特征尺寸测量提供高分辨率
- Auto-ID 可以识别可视范围内的所有工件，甚至多个不同工件
- 独有的变焦 Anywhere™ 技术 可以在可视区域的任何地方放大并测量细节尺寸
- 150 mm Z-轴行程 和长工作距离 为大零件和夹具提供了充足的空间
- 自动聚焦，SNAP-X综合软件
- 可选配接触式探针，提供高精度Z轴测量



测量软件

SNAP-X™ 测量软件可以在一个程序内完成一整套的特征测量,无论有多少个测量点或测量步骤。

SNAP 可以自动识别工件及其方向,无需手动调节。程序也很简单,从CAD导入开始,测量样件,或放置好一个工件后,直接测量



系统重量: 1050 kg

	标配	选配
测量单元	坚固钢结构和圆柱, 花岗岩表面平板	
最大测量范围(X,Y,Z)	450 x 450 x 150 mm	
工作台	精密机械复合 X,Y 平台和精密 Z-轴平台, 直流伺服驱动 350 x 350 x 150 mm 行程范围	
光学系统	完全远心镜头, 双放大, 自动聚焦; 包含校准块	
最大平台载重	30 kg	
Z-轴自动聚焦分辨率	0.1 mm	
视场大小 (mm)	低倍: 100 mm 直径 高倍: 24.5 mm 直径	低倍: 78 mm 直径 高倍: 19.5 mm 直径
景深 (mm)	低倍: 50 mm 高倍: 10 mm	低倍: 40 mm 高倍: 5 mm
照明	All-LED, 光显微镜下的剖面光, 同轴面光, 8扇区可编程环形光	
相机	QVI 大视场兆像素测量相机	QVI 高密度兆像素计量相机
图像处理	SNAP 先进的图像分析, 256级灰度, 10:1 - 50:1 次像素分辨率	
控制单元	多功能手动控制器, 配 3-轴操纵杆和灯光控制器	
系统控制 <small>*不预先通知更改配置</small>	QVI 标配系统, 带网络接口和通讯端口*	单一平板液晶显示器, 或双液晶显示器; 键盘鼠标
额定环境	20 ± 1° C (额定), 15-30° C (最大操作范围)	
电源	120 / 240 VAC, 50/60 HZ, 1-phase, 750W	
XY 精度* (E ₂)	(3.0 + 8L/1000) μm	
Z 精度 (E ₁)		(5.0 + 6L/1000) μm (选配配的接触式探针)

* L = 测量长度(毫米). 适用于每个光学放大下的最小视场大小和整个X-轴行程范围. QVI校准块 P/N 638696 适合标准 FOV; 640685 适合选配 FOV.
校准块必须放在标准测量平面上。定义垂直于光学轴在0.5毫米或0.02英寸以及5毫米或0.2英寸范围内为最佳聚焦距离。重量不超过2.5千克或5磅, 且均匀分布在工作台面上
适用于在相关环境下校准和工作的热稳定系统。



华南地区总代理: 三和系统有限公司

地址: 香港九龙新蒲岗, 五芳街 28 号, 利森工业大厦 10 楼 5 室 电话: 00852-28939363 传真: 00852-28381572
Email: info@tritec-systems.com http: www.tritec-systems.com

RAM

东莞销售公司: 东莞市天测光学设备有限公司

地址: 广东省东莞市南城区周溪彭洞工业区 B 栋一楼 2 号. 电话: 0769-33215215 传真: 0769-89026366.
Email: info@tiance-optical.com http: www.tiance-optical.com